CEI 60749-8 (Première édition – 2002) IEC 60749-8 (First edition – 2002)

## DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS -MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 8: Etanchéité

## SEMICONDUCTOR DEVICES - MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 8: Sealing

## **CORRIGENDUM 2**

Page 6

Page 7

Au lieu de:

Instead of:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

lire:

read:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

Août 2003 August 2003